



Flatek设备部门简介

ATE 测试系统

Burn-In 老化测试系统

SSD 模块测试系统



设备发展历程

日本三菱株式会社_扶植半导体事业部
山田电音 Yamada

TPF 自研成功并完成销售第一台 嵌入式产品 FPGA rev. 老化测试设备并完成销售

1950

2013

2016

2017

购入山田电音 Yamada 智慧财产，成立日本 TPF 崇诚科技。

在台湾成立设备部门研发组织

自研成功嵌入式产品 ARM rev. 高阶老化测试系设备

2020

自研成功 SSD 模块老化测试系设备 (车工规)并完成销售

TPF 自研成功100Mhz ATE 测试设备已投入量产验证中

2021

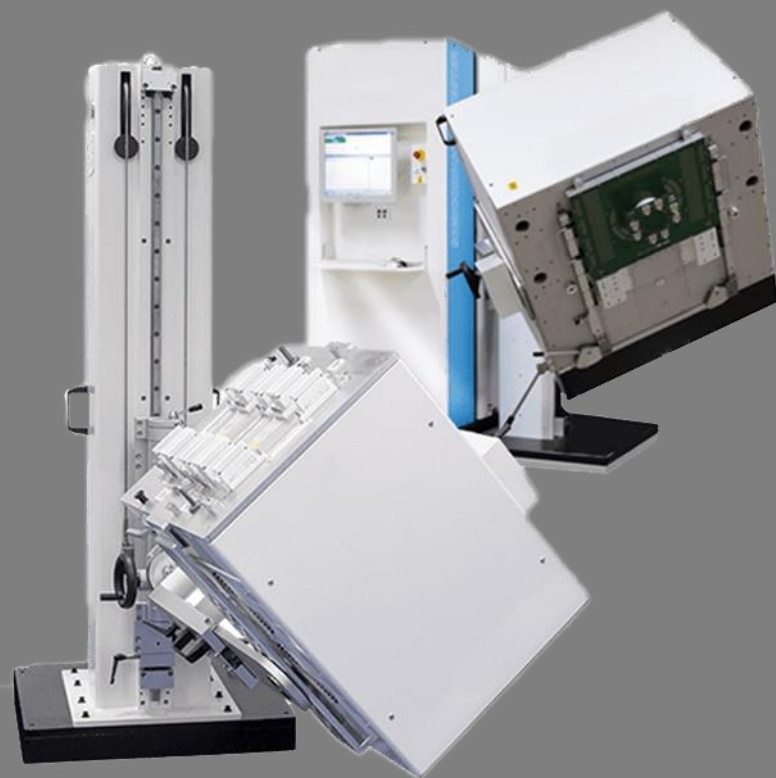
设备销售实绩

- 自研 嵌入式刻录设备 2台
- 自研 嵌入式老化设备 25台
- 自研 SSD模块老化设备 2台
- 打入华天/江波龙等一线大厂设备供货商

2022

接口设备研发实绩

- 合研 陆版宽温老化炉_已销售
- 合研 自动上下料机_已销售
- 合研 炮塔一体机_专利已取得
- 合研 台版宽温老化炉_已销售



Fatek Test System

ATE 测试系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638003127105006120>